

« Caractérisation expérimentale des matériaux et produits : de l'analyse de routine aux techniques avancées »

Mardi 10 Mai 2022 - 85, avenue des frères Perret, Saint-Fons (69)

8h30 – 9h	Accueil des participants	
9h00 – 9h10	Introduction de la journée	AXELERA
9h10 – 10h30	Session 1 : Microscopies	
9h10-9h30	Microscopie électronique au Centre Technologique des Microstructures : prestations proposées et exemples d'applications aux polymères, batteries et émulsions	Xavier Jaurand Centre Technologique des Microstructures, UCBLyon1
9h30-9h50	Microscopie électronique in situ operando et corrélative pour l'étude de la matière : naissance, vie et transformation des nanomatériaux	Ovidiu Ersen , Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg
9h50-10h10	Utilisation des microscopies MEB-EDS et FTIR pour l'étude de matériaux industriels	Céline Brunon , SERMA – Science et Surface
10h10-10h30	Microscopie élémentaire par laser pour la caractérisation chimique de surface des matériaux industriels	Florian Trichard , Ablatom
10h30-10h55	Pause	
10h55-11h10	Présentation du dispositif « France Relance - préservation de l'emploi R&D »	Flavie Barthès Prévot , CNRS
11h10-11h50	Session 2 : RMN	
11h10-11h30	Le CCRMN : de la routine aux techniques avancées	Anne Baudouin , Centre commun de RMN, UCBLyon1
11h30-11h50	Le CRMN : RMN à haute résolution et sensibilité avec les champs magnétiques très élevés	Guido Pintacuda Centre de RMN à Très Hauts Champs de Lyon
11h50-12h30	Networking	
12h30-13h45	Pause Déjeuner	
13h45-14h45	Session 3 : Technologies RX	
13h45-14h05	Diffusion des rayons X aux petits angles aux laboratoires : applications possibles en industrie	Benjamin Abécassis , Laboratoire de Chimie, ENS Lyon
14h05-14h25	ESRF - The European Synchrotron	Athanasios Papazoglou , ESRF
14h25-14h45	Les avantages de la microtomographie à rayons X synchrotron pour la caractérisation 3D des matériaux	Olivier Guiraud , Novitom
14h45-15h10	Pause	
15h10-16h10	Session 4 : Spectroscopies de masse	
15h10-15h30	Caractérisation d'échantillons «poly»dispersés par spectrométrie de masse sur la plateforme ILMTech	Clothilde Zerbino Institut Lumière Matière, iLMTech
15h30-15h50	Spectrométrie de masse ultra-haute résolution et couplages multidimensionnels pour la déformulation des échantillons les plus complexes	Alexandra Berlioz-Barbier , IFPEN
15h50-16h10	UHPLC/Triple Quadrupole: un outil indispensable pour l'analyse de trace	Frederic Le-Guyader , Solvay
16h10-16h30	Conclusions	